（大臣官房審議官（製造産業局担当））経済産業事務官　市川　雅一
辞職を承認する（七月三十一日）
黒田　篤郎
経済産業事務官（大臣官房審議官）に採用する
製造産業局担当を命ずる
（産業技術環境局地球環境対策室長）経済産業事務官　村上　敬亮
資源エネルギー庁に出向させる（以上八月一日）
（経済産業政策局長）経済産業事務官　安達　健祐
経済産業事務次官に昇任させる
（内閣官房内閣審議官（内閣官房副長官補付））内閣事務官　立岡　恒良
経済産業事務官（大臣官房長）に昇任させる
経済産業研修所長に併任する
（商務情報政策局長）経済産業事務官　石黒　憲彦
経済産業政策局長に配置換する
地域経済再生担当を免ずる
（大臣官房長）同　上田　隆之
製造産業局長に配置換する
経済産業研修所長の併任を解除する
（近畿経済産業局長）同　永塚　誠一
商務情報政策局長に昇任させる
（中小企業庁次長）同　豊永　厚志
大臣官房商務流通審議官に転任させる
（大臣官房商務流通審議官）同　深野　弘行
原子力安全・保安院に出向させる
（製造産業局長）同　鈴木　正徳
中小企業庁長官に昇任させる
（中小企業庁長官）同　高原　一郎
大臣官房付に配置換する
（大臣官房付）同　寺澤　達也
通商政策局通商機構部長に昇任させる
（大臣官房審議官（製造産業局担当））同　長尾　正彦
近畿経済産業局長に配置
（通商政策局通商機構部長）同　糟谷　敏秀
資源エネルギー庁に出向させる
（大臣官房審議官（政策総合調整担当））同　宮川　正
中小企業庁に出向させる
大臣官房審議官に併任する
（大臣官房付）同　加藤　洋一
中小企業庁に出向させる
（中小企業庁事業環境部長）同　伊藤　仁
大臣官房付に転任させる
内閣官房に出向させる
（資源エネルギー庁電力・ガス事業部長）同　横尾　英博
大臣官房付に転任させる
辞職を承認する
（経済産業事務次官）　松永　和夫
辞職を承認する（以上八月十二日）
経済産業事務官（大臣官房付）に採用する　中富　道隆
辞職を承認する（八月十三日）
（内閣府沖縄振興局長）内閣府事務官　大辻　善弘
経済産業事務官（大臣官房付）に転任させる
辞職を承認する（八月十五日）

官庁報告

産　業

日本工業規格

日本工業標準調査会の調査審議を経て、平成23年10月20日に下記の日本工業規格を制定及び改正したので、工業標準化法（昭和24年法律第185号）第16条の規定に基づき公示する。

平成23年10月20日　　経済産業大臣臨時代理
国務大臣　安住　淳

記

1．制定された日本工業規格

WDMデバイス通則	C5925―1
光ファイバコネクタ光学互換―第2―1部：シングルモード直角PC端面光ファイバ光学互換標準の指針	C5965―2―1
光ファイバコネクタ光学互換―第2―2部：シングルモード斜めPC端面光ファイバ光学互換標準の指針	C5965―2―2
光ファイバコネクタ光学互換―第3―1部：シングルモード光ファイバ用直径2.5㎜及び1.25㎜円筒形全ジルコニア直角PC端面フェルール光学互換標準	C5965―3―1
光ファイバコネクタ光学互換―第3―2部：シングルモード光ファイバ用直径2.5㎜及び1.25㎜円筒形全ジルコニア8度斜めPC端面フェルール光学互換標準	C5965―3―2
光増幅器―測定方法―第3―1部：雑音指数パラメータ―光スペクトラムアナライザ法	C6122―3―1
フェロシリコン分析方法―第1部：けい素定量方法	G1312―1
フェロシリコン分析方法―第2部：炭素定量方法	G1312―2
フェロシリコン分析方法―第3部：りん定量方法	G1312―3
フェロシリコン分析方法―第4部：硫黄定量方法	G1312―4
フェロシリコン分析方法―第5部：アルミニウム定量方法	G1312―5
フェロシリコン分析方法―第6部：チタン定量方法	G1312―6
シリコマンガン分析方法―第1部：マンガン定量方法	G1314―1
シリコマンガン分析方法―第2部：けい素定量方法	G1314―2
シリコマンガン分析方法―第3部：炭素定量方法	G1314―3
シリコマンガン分析方法―第4部：りん定量方法	G1314―4
シリコマンガン分析方法―第5部：硫黄定量方法	G1314―5
シリコマンガン分析方法―第6部：ほう素定量方法	G1314―6
エネルギーマネジメントシステム―要求事項及び利用の手引	Q50001

2．改正された日本工業規格

低圧電気設備―第4―43部：安全保護―過電流保護	C60364―4―43
低圧電気設備―第4―44部：安全保護―妨害電圧及び電磁妨害に対する保護	C60364―4―44
亜鉛，アルミニウム及びそれらの合金溶射	H8300
識別カード―非接触（外部端子なし）ICカード―近接型―第2部：電力伝送及び信号インタフェース	X6322―2
識別カード―非接触（外部端子なし）ICカード―近接型―第3部：初期化及び衝突防止	X6322―3
識別カード―非接触（外部端子なし）ICカード―近接型―第4部：伝送プロトコル	X6322―4
超音波探傷器の電気的性能測定方法	Z2351
マイクログラフィックス用語	Z6000
マイクロ写真用解像力試験図票とその用法	Z6008
銀―ゼラチンマイクロフィルムの処理及び保存方法	Z6009

（内容省略）

備考　内容は、日本工業標準調査会ホームページ（http://www.jisc.go.jp）において閲覧に供する。また、経済産業省産業技術環境局基準認証政策課、各経済産業局及び沖縄総合事務局経済産業部においても閲覧に供する。

日本工業標準調査会の調査審議を経て、平成23年10月20日に下記の日本工業規格を確認したので、工業標準化法（昭和24年法律第185号）第16条の規定に基づき公示する。

平成23年10月20日　　経済産業大臣臨時代理
国務大臣　安住　淳

記

確認された日本工業規格

建築用開口部構成材の標準モデュール呼び寸法	A0005
構造用軽量細骨材の密度及び吸水率試験方法	A1134
構造用軽量粗骨材の密度及び吸水率試験方法	A1135